

Атомно-силовой микроскоп MultiMode V, Veeco, США



Атомно-силовой микроскоп MultiMode V – определение наноскопической морфологии (рельефа) любых типов твердых поверхностей.

Электрохимическая приставка позволяет регистрировать изменение поверхности электрода в ходе электрохимической реакции на нано и микроуровне.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ – 0-5000 нм.